

# Using LR-SMOTE-Based Approach to Perform Fault Diagnosis of WAT and CP between FEOL and BEOL in Semiconductor Manufacturing

科技部工業工程學門召集人

國際期刊首位亞洲主編

Speaker:

Prof. Dr. Fan, Shu-Kai

范書愷教授

現職：國立台北科技大學  
工業工程與管理系



Time : Nov. 12 Thu. 13:00 ~ 15:00

Venue : Management Building M627

主辦單位：亞洲大學管理學院、經營管理學系